01:05.2

## Модель высокотемпературной сверхпроводимости в низкокоординированных полупроводниках и полимерах

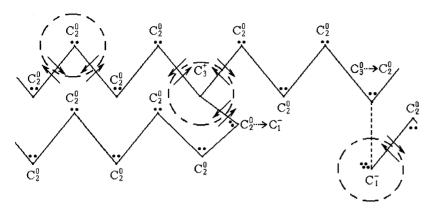
© Б.П. Попов, К.Д. Цэндин

С.-Петербургский государственный технический университет Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург

Поступило в Редакцию 23 декабря 1997 г.

Предложена модель, в которой состояние с аномально высокой проводимостью, наблюдаемое при температуре окружающей среды  $T_0 \approx 300\,\mathrm{K}$ , в некоторых низкокоординированных полупроводниках и полимерах описывается теорией сверхпроводящих свойств системы локализованных пар электронов. Сверхпроводящие свойства модели обусловлены переносом по зоне биполяронов, образованной локализованными парами носителей, принадлежащих  $U^-$ -центрам, т. е. собственным дефектам с отрицательной эффективной энергией корреляции.

В настоящее время широко обсуждается природа высокопроводящих каналов, образующихся в пленках низкокоординированных полупроводников [1] и полимеров [2]. В пленках микронной толщины (L) халькогенидных стеклообразных полупроводников (ХСП) высокопроводящие каналы возникают при воздействии сильного электрического поля  $(\sim 10^5 \, \text{V/cm})$ . В [3] считалось, что температура канала  $T = 300 - 360 \, \text{K}$ , в то время как в [4] приводились значения  $T \approx 500 \, \mathrm{K}$ . Основное падение напряжения и соответственно основное сопротивление сосредоточены в узкой приконтактной области, равной  $\sim 0.1 L$ . Напряжение на остальной длине канала 0.9L и соответственно ее проводимость, строго говоря, неизвестны. Ниже речь будет идти только о свойствах этой части канала. Множество работ, посвященных попыткам объяснить высокопроводящее состояние, анализируются в книгах [1,5], из которых следует, что ни одно из объяснений не является окончательным и общепризнаным. Этот факт, а также возможность приписать основной части канала сколь угодно высокую проводимость позволяет выдвинуть следующую гипотезу.



**Рис. 1.** Схематическое изображение структуры стеклообразного Se. Пояснения в тексте

Основным типом собственных дефектов в ХСП являются центры, на которых, из-за взаимодействия электронов с решеткой, существует эффективное притяжение электронов, так что на них локализуются пары электронов. Концентрация этих так называемых  $U^-$ -центров  $10^{17}$   $-10^{19}$  cm<sup>-3</sup>. В то же время в работах [6,7] еще в начале 80-х годов были теоретически рассмотрены сверхпроводящие свойства системы  $U^-$ -центров. Опишем  $U^-$ -центры для простейшего XCП — стеклообразного Se. На рис. 1 левым пунктирным кружком обведена основная структурная единица  $C_2^0$  (верхний и нижний индексы — зарядовое состояние и координационное число) вместе с принадлежащими ей электронами. Два неподеленных электрона (LP-электроны р-типа), не участвующие в связях с ближайшими соседями, изображены двумя черными точками. Пунктирным кружком в центре рис. 1 обведен дефект  ${
m C}_{3}^{+}$ , являющийся результатом однократной ионизации нейтрального дефекта  $C_3^0$ . Согласно [8],  $C_3^0$  имеет наименьшую энергию образования (Е) среди всех нейтральных дефектов. В ХСП еще меньшую Е имеют заряженные дефекты, т.е. реакция

$$2C_3^0 \to C_3^+ + C_1^- \tag{1}$$

является экзотермической. На рис. 1 правым пунктирным кружком выделен дефект  $\mathrm{C}_1^-$  и схематически показано, как он образуется из

Письма в ЖТФ, 1998, том 24, № 7

дефекта  $C_3^0$  с помощью разрыва связи, нанесенной пунктиром. Концентрация заряженных дефектов (N) велика из-за низкой координации и неучастия LP (p)-электронов в образовании химической связи с ближайшими соседями в основной сетке XCП. Именно благодаря этому LP (p)-электроны имеют возможность вступать в химические связи при возникновении дефектов и тем самым создавать дефекты с небольшой E. Считая  $N=N_0\exp(-E/kT)$ , получаем для  $N_0=10^{22}\,\mathrm{cm}^{-3}$ ,  $N=10^{18}\,\mathrm{cm}^{-3}$  и  $T=300\,\mathrm{K}$  величину  $E=0.25\,\mathrm{eV}$ .

В смысле статистики реакция (1) означает, что каждый из заряженных дефектов равное время находится в одном и другом зарядовых состояниях, обмениваясь при этом зарядами с соседями. При понижении температуры основным состоянием системы  $U^-$ -центров может стать состояние с одновременной синхронной перезарядкой макроскопического числа дефектов, т. е. возникнет когерентное состояние.

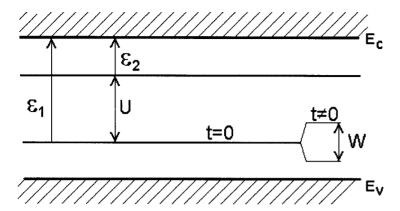
Запишем гамильтониан Хаббарда рассматриваемой модели

$$H = -U \sum_{i} n_{i} \uparrow n_{i} \downarrow + \sum_{ij\sigma} t_{ij} a_{i\sigma}^{\dagger} a_{j\sigma}, \qquad (2)$$

где  $n_{i\sigma}=a_{i\sigma}^{+}a_{i\sigma}$  — числа заполнения,  $a_{i\sigma}^{+}$  и  $a_{i\sigma}$  — операторы рождения и уничтожения электронов со спином  $\sigma$  на дефекте i. Будем считать так же, как и в [6,7], что заряженные дефекты составляют кубическую решетку и все интегралы переноса равны t. Специфика модели отражена в величине и знаке коэффициента -U. Минус соответствует притяжению электронов на дефекте i. Описание сверхпроводимости в теории БКШ соответствует неравенству  $t\gg U$ , когда существует широкая зона одноэлектронных состояний, а спаривание электронов актуально только для электронов с энергией, близкой к энергии Ферми  $(E_f)$ . Возникновение щели и пара происходит одновременно, а сверхпроводящий ток переносится только небольшой частью электронов с энергией  $\sim E_f$ .

Обратное соотношение  $t \ll U$  описывает модель локализованных пар [6,7]. При t=0 все пары локализованы на дефектах  $C_1^-$  и  $C_3^+$ . На одноэлектронной зонной диаграмме (рис. 2) эти состояния можно изобразить с помощью энергии термической ионизации  $\varepsilon_1$  дефекта  $C_1^-$ , который при этом переходит в дефект  $C_3^0$ , и энергии термической ионизации  $\varepsilon_2$ , необходимой для перехода последнего в состояние  $C_3^+$ . При этом  $\varepsilon_2 - \varepsilon_1 = -U < 0$ . Конечное значение интеграла переноса t обусловливает появление зоны биполяронов шириной  $W=2zt^2/U$ ,

Письма в ЖТФ. 1998. том 24. № 7



**Рис. 2.** Энергетическая диаграмма системы  $U^-$ -центров.  $\varepsilon_1$  и  $\varepsilon_2$  — энергии первой и второй термических ионизаций изолированного центра (t=0). W — ширина биполяронной зоны, возникающей при конечном значении интеграла переноса -t.

где z=6 — число дефектов, ближайших к данному, по которым может двигаться биполярон. Согласно [6,7], сверхпроводящее состояние возникает при температуре

$$T_c = W(1 - 2\nu) / \ln(\nu^{-1} - 1),$$
 (3)

где  $\nu$  — отношение числа биполяронов к полному числу мест N, по которым они могут двигаться. Щель в спектре, возникающая при  $T < T_c$ , равна  $\Delta = W |\alpha|^2$ , где  $|\alpha|$  — модуль параметра порядка.

Видно, что в модели локализованных пар температура перехода и щель имеют величину порядка самой зоны W. Это связано с тем, что локализованные пары существуют и при W=0, а корреляция в их движении возникает в результате междефектных переходов. В отличие от теории БКШ в сверхпроводящем переносе участвуют все электроны. Экспериментальные данные, приведенные выше, получены на ХСП с шириной запрещенной зоны  $E_g\approx 1~{\rm eV}.~U$  обычно равна  $\sim E_g/2$ , поэтому примем, что  $U=0.5~{\rm eV}.$  Запишем для оценки интеграл переноса в виде  $t=t_0\exp(-2r/a)$ , где r— расстояние между дефектами, a— радиус волновой функции. Согласно [9], можно для оценки считать, что  $t_0\approx 5~{\rm eV}.$  Величину  $\nu$  положим равной  $\sim 1/4.$  Это значит,

Письма в ЖТФ, 1998, том 24, № 7

что в материале имеются акцепторы, компенсирующие  $U^-$ -центры, и поэтому  $\nu < 1/2$ . При  $T=500\,\mathrm{K}$  число дефектов увеличивается до  $\sim 5\cdot 10^{19}\,\mathrm{cm}^{-3}$ , откуда  $r=25\,\mathrm{Å}$ . Согласно [8,10], электронные состояния на  $\mathrm{C}_3^+$  и  $\mathrm{C}_1^-$  аналогичны неглубоким донорным и акцепторным состояниям, так что можно считать радиус a равным  $\sim 10\,\mathrm{Å}$ . Подставляя эти значения в (3), получаем  $T_c=500\,\mathrm{K}$ . Таким образом, мы получили, что наличие в системе  $U^-$ -центров с концентрацией  $5\cdot 10^{19}\,\mathrm{cm}^{-3}$  может объяснить высокотемпературную проводимость с величиной температуры перехода выше комнатной.

Проводящие каналы в полимерных пленках ( $L\sim10\,\mu\mathrm{m}$ ) возникают при совместном действии напряжения  $V\leqslant10^3\,\mathrm{V}$  и одноосного давления. Особенно впечатляющими оказались эксперименты с переводом в сверхпроводящее состояние электродов — сопротивление канала при этом было не больше приборного нуля, а оценка проводимости канала превосходила проводимость лучших металлов [11–12]. Аномально высокая проводимость наблюдалась в окисленных пленках. Кислород находится в одной группе периодической таблицы с Se и так же, как и он, в подавляющем числе случаев демонстрирует валентность, равную двум, оставляя два своих LP (p)-электрона не задействованными в связях с ближайшими соседями. Это обстоятельство, а также низкокоординированность полимеров (их лабильность) позволяют предположить, что, как и в XСП, в окисленных полимерах возможно появление достаточно большой концентрации  $U^-$ -центров.

Авторы выражают благодарность А.М. Ельяшевичу, В.А. Закревскому, А.Н. Ионову и В.Ф. Мастерову за полезные обсуждения и Российскому фонду фундаментальных исследований за поддержку (грант N 97-02-18079).

## Список литературы

- [1] Лебедев Э.А., Цэндин К.Д. // Электронные явления в халькогенидных стеклообразных полупроводниках // Под ред. К.Д. Цэндина, СПб.: "Наука" РАН, 1996. С. 224–279.
- [2] Pagnia H., Sotnik N. // Phys. Stat. Sol. (a) 1988. V. 108. N 11. P. 11-65.
- [3] Petersen K.E., Adler D. // Appl. Phys. Lett. 1975. V. 27. N 11. P. 625-629.
- [4] Коломиец Б.Т., Лебедев Э.А., Таксами И.А., Цэндин К.Д. // ФТП. 1983. Т. 17. N 1. C. 119–124.
- 4 Письма в ЖТФ, 1998, том 24, № 7

- [5] *Меден А., Шо М.* Физика и применение аморфных полупроводников. М.: Мир, 1991. 670 с.
- [6] Кулик И.О., Педан А.Г. // ЖЭТФ. 1980. Т. 79. № 4. С. 1469–1482.
- [7] Булаевский Л.Н., Собянин А.А., Хомский Д.И. // ЖЭТФ. 1984. Т. 87. № 4. С. 1490–1500.
- [8] Kastner M., Adler D., Fritzsche H. // Phys. Rev. Lett. 1976. V. 37. N 22. P. 1504–1507.
- [9] Коулсон Ч. Валентность. М.: Мир, 1965, 426 с.
- [10] Street R.F., Mott N.F. // Phys. Rev. Lett. 1975. V. 35. N 19. P. 1293–1296.
- [11] *Архангородский В.М., Ионов А.Н., Тучкевич В.М., Шлимак И.С.* // Письма в ЖЭТФ. 1990. Т. 51. № 1. С. 56–61.
- [12] Ельяшевич А.М., Ионов А.Н., Ривкин М.М., Тучкевич В.М. // ФТТ. 1992. Т. 34. № 11. С. 3457–3463.